

Modelování spolehlivost



Výkonnost a spolehlivost – KIV/VSP

Richard Lipka

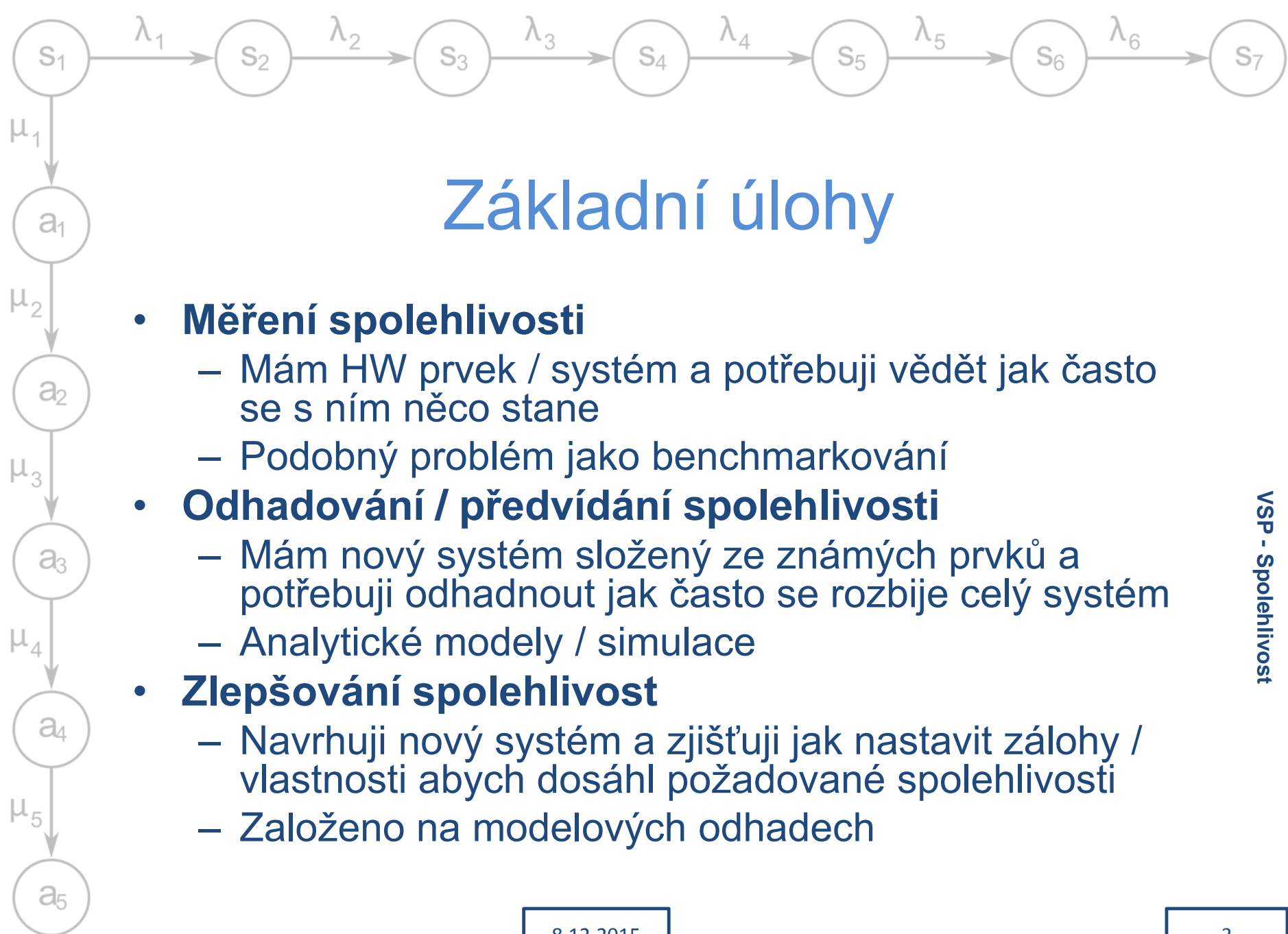
8.12.2015



Motivace

- Určení spolehlivosti nového HW
 - Jak dlouho vydrží CPU než se rozbije?
- Určení spolehlivosti HW složeného ze známých modulů
 - Jak dlouho vydrží fungovat směrovač / dron / satelit / ... ?
- Určení velikosti záloh
 - Kolik náhradních komponent potřebuji aby systém fungoval po zadanou dobu?
- Modely velmi obecné
 - Ne jen pro elektronické systémy
 - Založené na statistice – vždy jen pravděpodobnosti a rozdělení! (pravděpodobnost poruchy 0,1% neznamená že porucha nenastane)

VSP - Spolehlivost



Základní úlohy

- **Měření spolehlivosti**
 - Mám HW prvek / systém a potřebuji vědět jak často se s ním něco stane
 - Podobný problém jako benchmarkování
- **Odhadování / předvídání spolehlivosti**
 - Mám nový systém složený ze známých prvků a potřebuji odhadnout jak často se rozbije celý systém
 - Analytické modely / simulace
- **Zlepšování spolehlivost**
 - Navrhuji nový systém a zjišťuji jak nastavit zálohy / vlastnosti abych dosáhl požadované spolehlivosti
 - Založeno na modelových odhadech



Definice spolehlivosti

„Obecná vlastnost objektu spočívající ve schopnosti plnit požadované funkce při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných mezích a v čase podle stanovených technických podmínek“

ČSN 010102
(Od roku 1993)

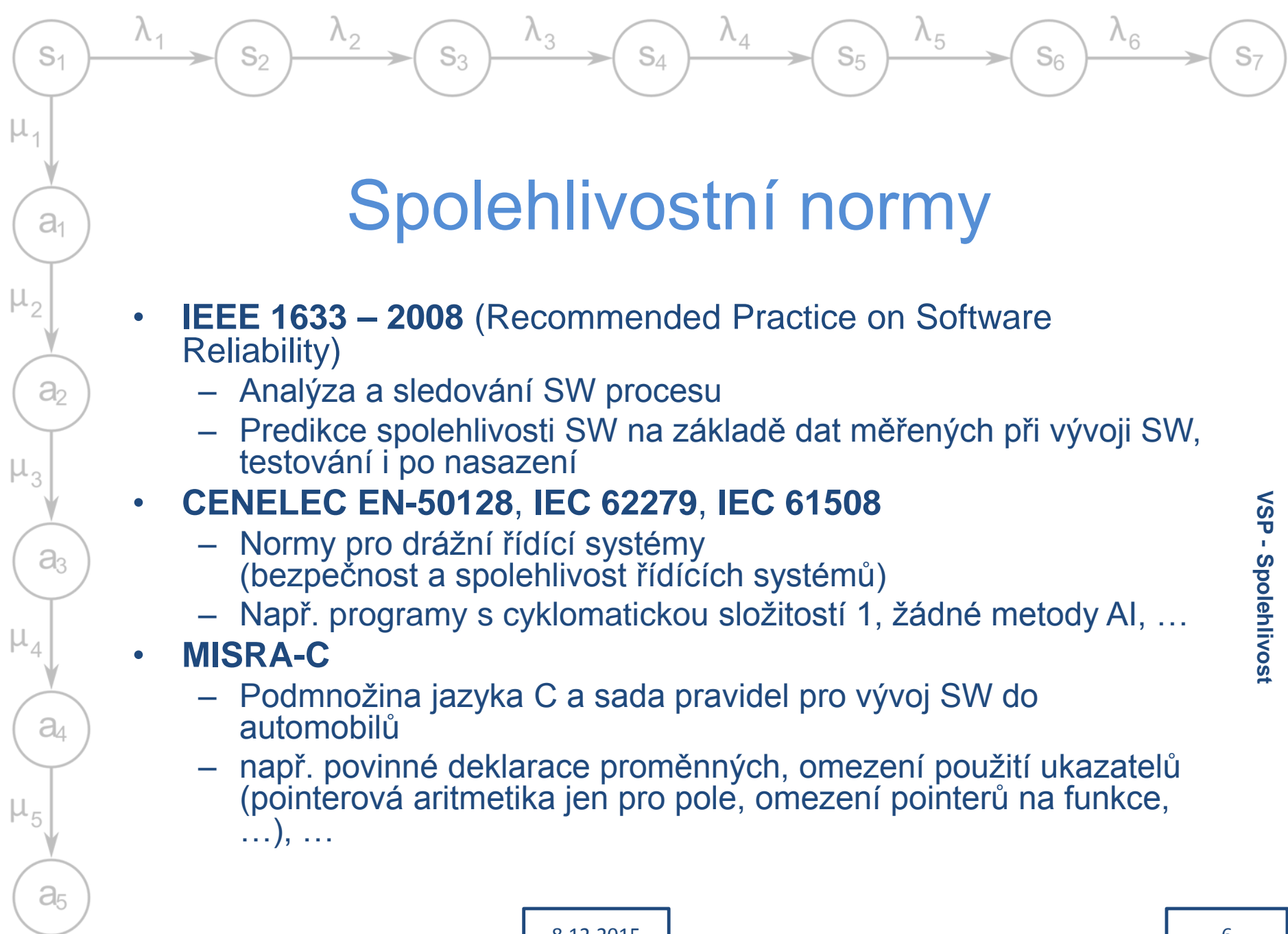
VSP - Spolehlivost

- Norma velmi obecná (a placená – dá se stáhnout v knihovně)
- Obvykle multikriteriální problém
 - zavádějí se „ukazatele spolehlivosti“ které se dají kvantifikovat



Spolehlivostní normy

- **MIL-HDBK-217x** (poslední F – notice 2)
 - Vojenská příručka, dá se stáhnout (<http://snebulos.mit.edu/projects/reference/MIL-STD/MIL-HDBK-217F-Notice2.pdf>)
 - Výrazně orientována na HW
 - Konkrétní modely a tabulky pro různé prvky
 - Hradla, paměti, relé, různé typy komponent a obvodů
 - Koeficienty a odhady pro použití na zemi a ve vzduchu
 - Založena na nasbíraných datech a měřeních



Spolehlivostní normy

- **IEEE 1633 – 2008** (Recommended Practice on Software Reliability)
 - Analýza a sledování SW procesu
 - Predikce spolehlivosti SW na základě dat měřených při vývoji SW, testování i po nasazení
- **CENELEC EN-50128, IEC 62279, IEC 61508**
 - Normy pro drážní řídicí systémy (bezpečnost a spolehlivost řídicích systémů)
 - Např. programy s cyklotmatickou složitostí 1, žádné metody AI, ...
- **MISRA-C**
 - Podmnožina jazyka C a sada pravidel pro vývoj SW do automobilů
 - např. povinné deklarace proměnných, omezení použití ukazatelů (pointerová aritmetika jen pro pole, omezení pointerů na funkce, ...), ...



Základní pojmy

- **Poruchy:**

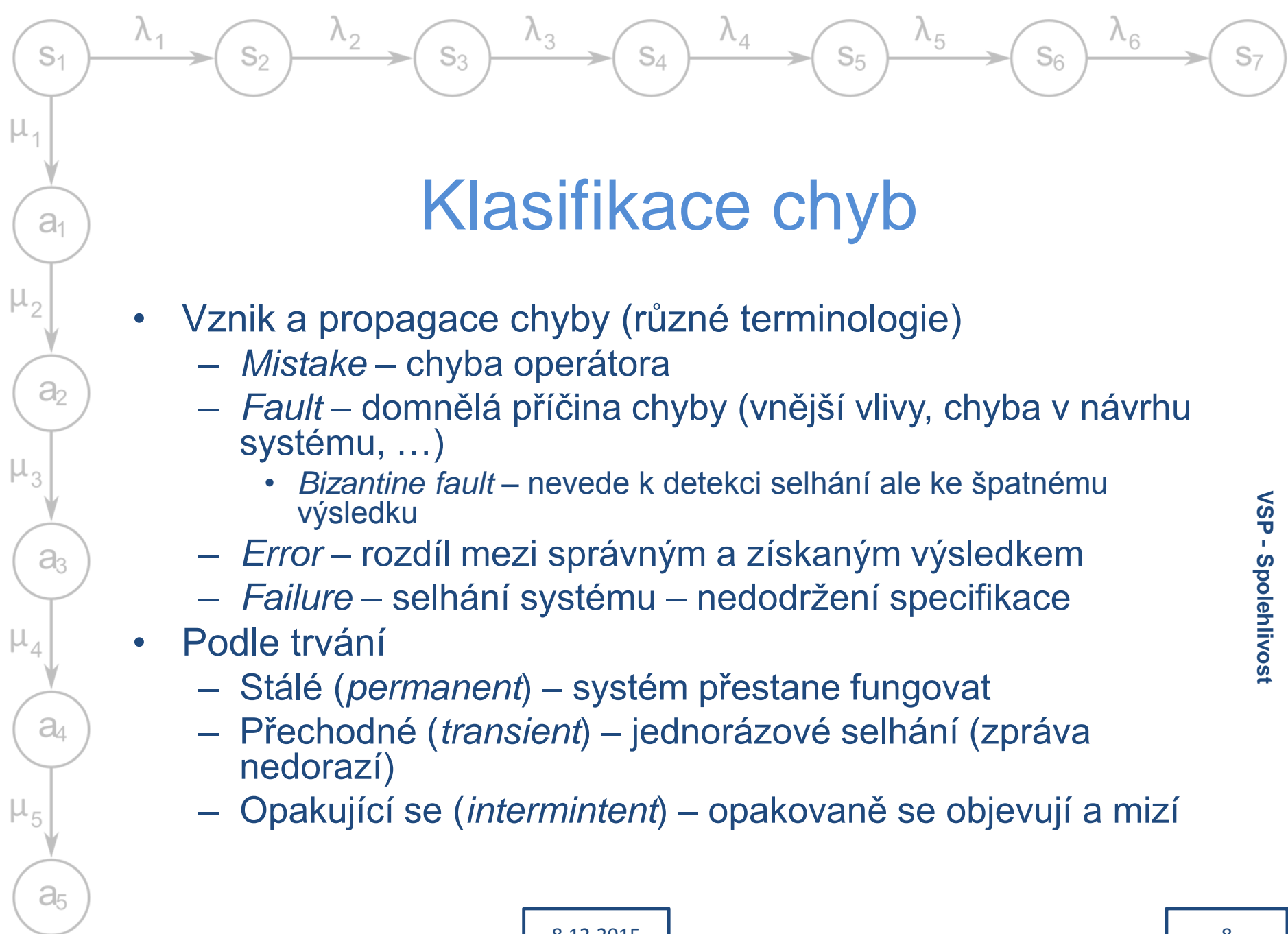
- Systematické – chyby v návrhu systému (zapomenuté kontroly, chyby operátora, přehřívání, ...)
- Náhodné – vnější vlivy mimo kontrolu (nárazy, počasí, radiace, ...)

- **Stavy:**

- Bezporuchový – systém normálně funguje
- Poruchový – systém neposkytuje požadovanou službu (dokážu ho detekovat?)

- **Systemy:**

- Obnovované – mohu je nějak opravit
- Neobnovované – po poruše jsou zničeny (neopravitelný HW, nedostupný systém, příliš nákladné, ...)



Klasifikace chyb

- Vznik a propagace chyby (různé terminologie)
 - *Mistake* – chyba operátora
 - *Fault* – domnělá příčina chyby (vnější vlivy, chyba v návrhu systému, ...)
 - *Bizantine fault* – nevede k detekci selhání ale ke špatnému výsledku
 - *Error* – rozdíl mezi správným a získaným výsledkem
 - *Failure* – selhání systému – nedodržení specifikace
- Podle trvání
 - Stálé (*permanent*) – systém přestane fungovat
 - Přechodné (*transient*) – jednorázové selhání (zpráva nedorazí)
 - Opakující se (*intermintent*) – opakovaně se objevují a mizí



Kategorie spolehlivosti

- **Nezabezpečené systémy – *fault avoidance***
 - „dělám vše co nejlépe“
- **Zabezpečené systémy – *fail safe***
 - po poruše přepnutí do bezpečného stavu
 - Řízení křižovatky, drážní provoz, ...
- **Systémy odolné proti poruchám – *fail tolerant***
 - Neexistuje bezpečný stav → porucha „nesmí nastat“
 - Řídící systémy letadla, zabezpečení letového provozu



Zajištění odolnosti proti poruchám

- Spolehlivostní normy
 - Sledování vývoje systému
 - Formální metody dokazování spolehlivosti (*Java Pathfinder*)
- Redundance
 - Obvodová (HW navíc)
 - Statická / horká záloha
 - Dynamická / studená záloha
 - Programová (SW navíc)
 - Dva týmy, 2 jazyky a stejný SW
 - Informační (data navíc)
 - Opakování zpráv
 - Časová (čas navíc)
 - Opakování výpočtů



Ukazatele spolehlivosti

- Zaměřené na náhodné poruchy
→ Obvykle chápány jako náhodné veličiny
- Popis distribuční funkcí (nebo známým rozdělením)

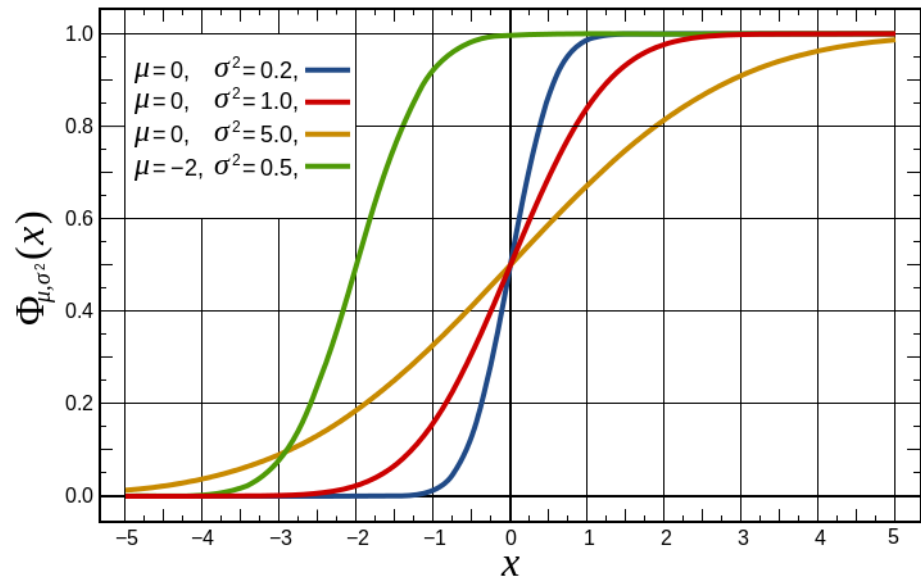
Pro zopakování:

Veličina

$\tau, (\tau > 0)$, lze najít $F(t)$

$F_\tau(t) = P(\tau < t)$,

kde $P(a)$ je pravděpodobnost jevu a a $t \geq 0$



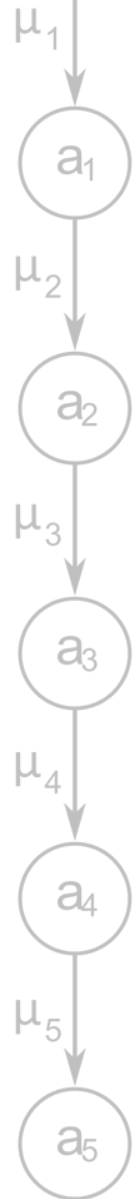
VSP - Spolehlivost



Ukazatele spolehlivosti – neobnovované objekty

– Doba od zapnutí do porouchání τ

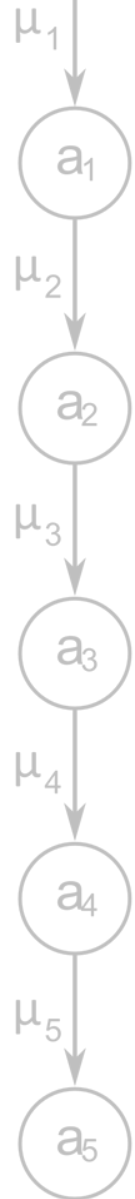
- Distribuční funkce $Q(t)$
 - **pravděpodobnost poruchy**
- Doplnková funkce do 1: $R(t) = 1 - Q(t)$
 - **pravděpodobnost bezporuchového stavu**
- Hustota pravděpodobnosti $f(t) = \frac{dQ(t)}{dt}$
 - **hustota poruch**
 - Prvd. poruchy v intervalu dt od času t
 $f(t) \cdot dt$





Ukazatele spolehlivosti – neobnovované objekty

- Poměr $\lambda(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{f(t)}{1-Q(t)}$
 - **intenzita poruch** (není to pravděpodobnosti – může přesáhnout 1)
- Podmíněná pravděpodobnost
 - Pravděpodobnost že objekt bude v čase $t + dt$ porouchaný za předpokladu že před tím (v čase t) byl v pořádku - $\lambda(t)dt$





Exponencialita

$$f(t) = -\frac{dR(t)}{dt}$$

$$\lambda(t) = -\frac{dR(t)}{dt} \cdot \frac{1}{R(t)}$$

$$-\lambda(t)dt = \frac{dR(t)}{R(t)}$$

$$R(t) = e\left(-\int_0^t \lambda(\tau)d\tau\right)$$

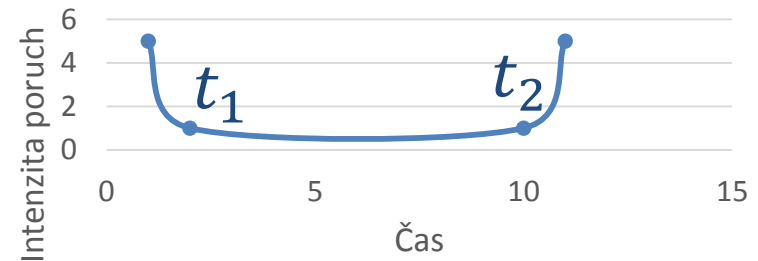
Pro konstantní λ :

$$R(t) = e\left(-\int_0^t \lambda d\tau\right) = e^{-\lambda t}$$

$$Q(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

$$f(t) = (1 - e^{-\lambda t})' = \lambda e^{-\lambda t}$$

Intenzita poruch



- Empiricky zjištěná „vanová křivka“
 - Po nějakou dobu lze λ považovat za konstantu
 - $Q(t)$ - distribuční funkce exponenciálního rozdělení
 - $f(t)$ - hustota pravděpodobnosti exponenciálního rozdělení

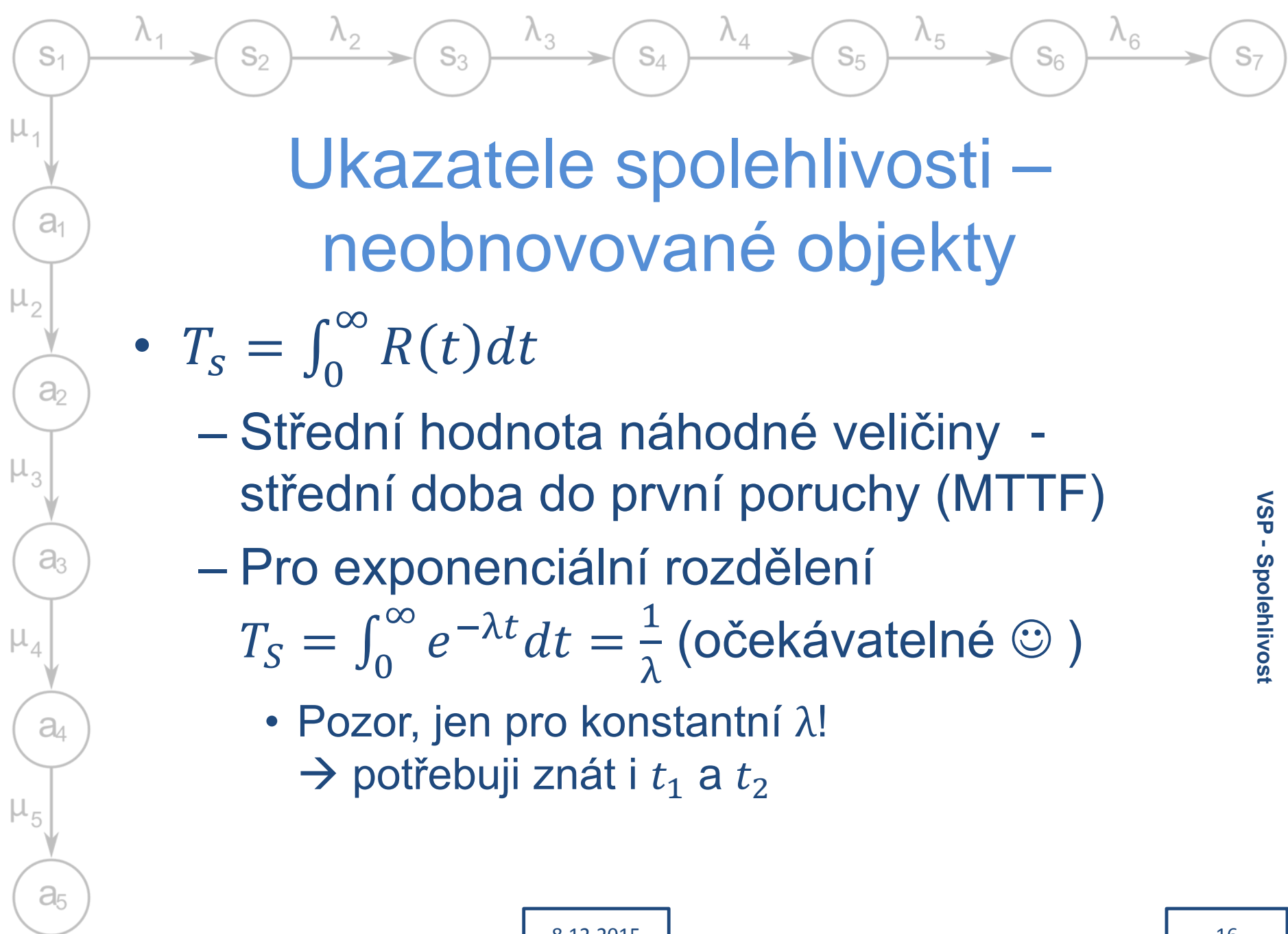
VSP - Spolehlivost



Intenzita poruch

- Pro další výpočty očekáváme konstantní λ
 - Pro integrované obvody někde mezi $10^{-8} 1/h$ – $10^{-5} 1/h$, obvykle nižší pro paměťové obvody než pro logické obvody (empiricky zjištěno)
- Modely v MIL-HDBK-217 ve stylu

$$\lambda = (C_1 \pi_T + C_2 \pi_E) \pi_Q \pi_L$$
 (sekce 5.1 – logický obvod)
 - C_1 - koeficient podle počtu hradel
 - C_2 - přibližný počet vývodů
 - π_T - vliv teploty (teplotních rozdílů), tabulka podle teploty a typu zařízení
 - π_Q - vliv kvality (norma podle které bylo zařízení vyrobeno)
 - π_L - vliv stáří návrhu (čím starší tím spolehlivější)
 - π_E - vliv okolních podmínek
 (příručka obsahuje tabulky s hodnotami)



Ukazatele spolehlivosti – neobnovované objekty

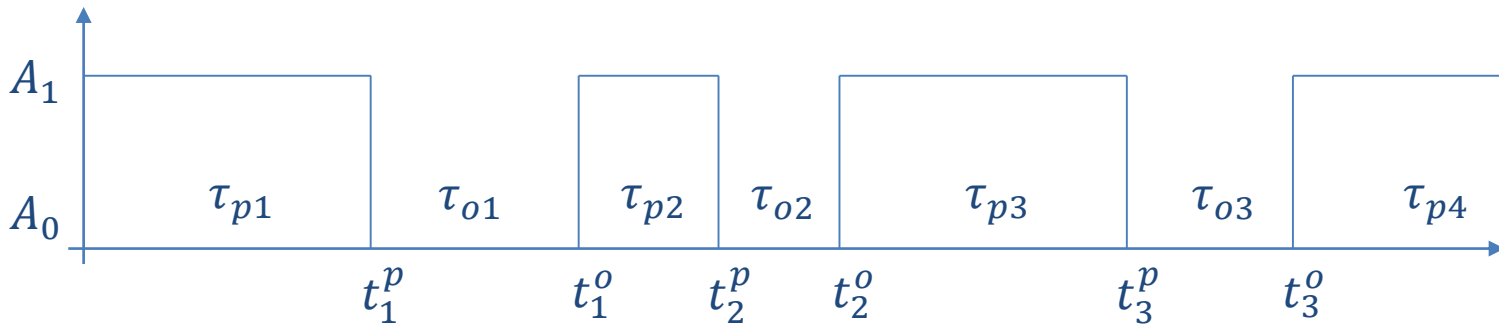
- $T_s = \int_0^{\infty} R(t) dt$
 - Střední hodnota náhodné veličiny - střední doba do první poruchy (MTTF)
 - Pro exponenciální rozdělení

$$T_s = \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda} \text{ (očekávatelné 😊)}$$
 - Pozor, jen pro konstantní λ !
 - potřebuji znát i t_1 a t_2



Ukazatele spolehlivosti – obnovované objekty

- Dochází k přechodům mezi bezchybným a chybovým stavem (poruchy a opravy)



- MTTF lze určit jako střední hodnotu τ_{pi}

$$T_S = \frac{t_p}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \tau_{pi}$$

- Podobně i MTBF (střední doba cyklu)

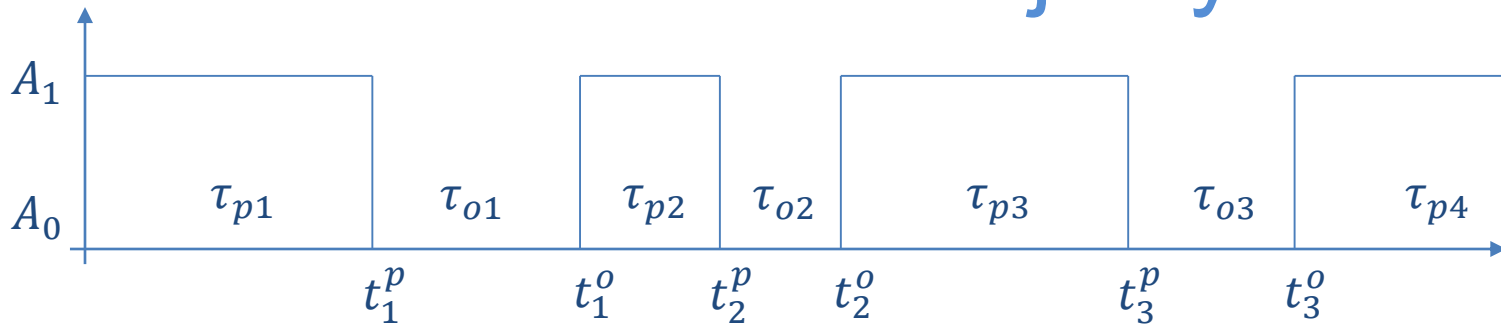
$$T_C = \frac{t}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\tau_{pi} + \tau_{oi})$$

VSP - Spolehlivost





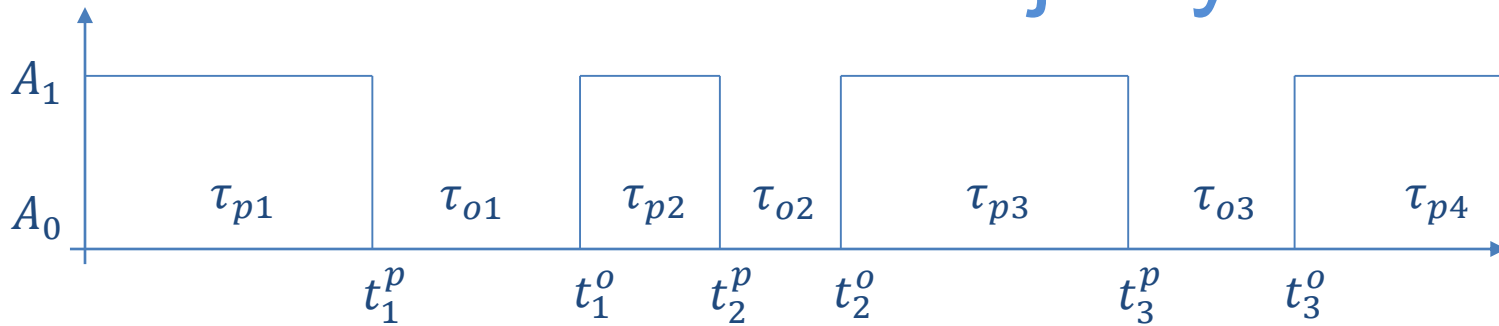
Ukazatele spolehlivosti – obnovované objekty



- Pravděpodobnost že bude v čase t v provozuschopném stavu $K_p(t)$
 - $K_p = \lim_{t \rightarrow \infty} K_p(t)$ - stacionární součinitel pohotovosti (prvd. že systém bude fungovat v libovolné době)
 - $K_p = \frac{t_p}{t_p + t_o} \left(= \frac{\sum_{i=1}^n \tau_{pi}}{\sum_{i=1}^n (\tau_{pi} + \tau_{oi})} \right)$



Ukazatele spolehlivosti – obnovované objekty



- MTTR lze zavést jako $T_o = \frac{t_o}{n}$
 - Pokud je náhodná s exponenciálním rozdělením lze také jako $T_o = \frac{1}{\mu}$
- Stacionární součinitel pohotovosti
 - $K_p = \frac{T_s}{T_s + T_q} = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$
- Součinitel prostoje – doplněk do jedné (prvd. nedostupnosti systému)
 - $K_n(t) = 1 - K_p(t), \quad K_n = \lim_{t \rightarrow \infty} K_n(t)$



Systemy s nezávislými prvky

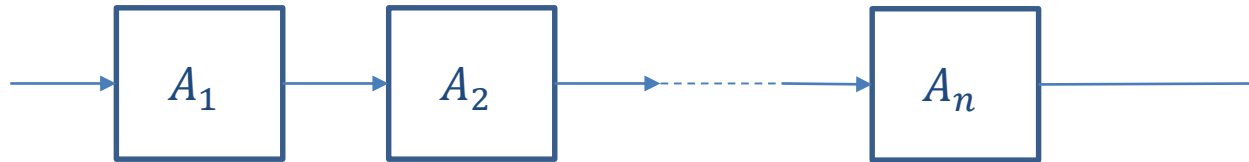
- System složený z více prvků se známými vlastnostmi (hradla, CPU a RAM, počítače, ... - podle úrovně modelu)
- Poruchy jednotlivých prvků mohou být nezávislé
 - CPU se rozbije bez ohledu na to že je rozbitá paměť
 - Pozor, některé poruchy mohou podmínit vznik jiné poruchy, pak nelze mluvit o nezávislosti

→ pak lze poruchy chápat jako nezávislé náhodné jevy

- Typické pro neobnovované systémy
 - Oprava podmíněna předchozí poruchou
- Spojení prvků – logické, z hlediska spolehlivosti (nemusí být kopie reálného zapojení obvodu)



Sériové zapojení



- Porucha jednoho prvku rozbije celý systém
 - Musíme znát $R_i(t)$ pro každý prvek („pravděpodobnost fungování“)
- Typicky pro výpočet spolehlivosti logického obvodu při znalosti jeho hradel (musí fungovat všechna)

$R(t) = \prod_{i=1}^n R_i(t)$, respektive pro konstantní λ

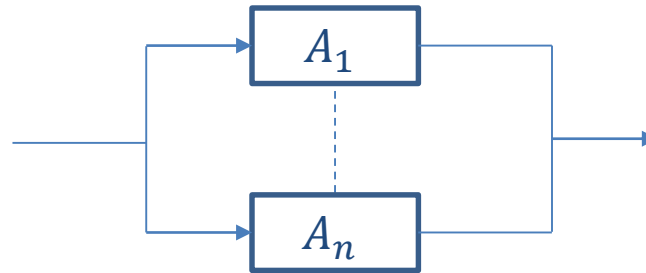
$R(t) = \prod_{i=1}^n e^{-\lambda_i t} = e^{-\lambda t}$, kde $\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i$

$$T_s = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \lambda_i} = \frac{1}{\lambda}$$

pokud mají prvky stejnou intenzitu poruch $T_s = \frac{1}{n\lambda_p}$



Paralelní zapojení



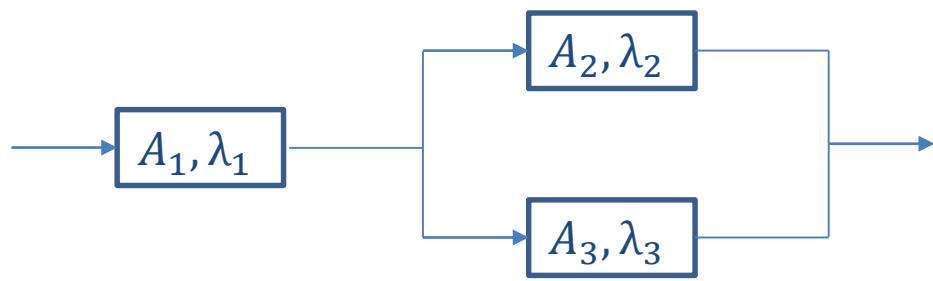
- Porucha všech prvků rozbije celý systém (stačí aby jeden fungoval)
 - Potřebuji znát $Q_i(t)$ („pravděpodobnost poruchy“) pro každý prvek
 - Modelování horké zálohy (všechny prvky fungují zároveň ale stačí mi jen jeden)

$$Q(t) = \prod_{i=1}^n Q_i(t)$$

$$R(t) = 1 - Q(t) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - R_i(t))$$



Kombinované modely



- Typický příklad, jednotlivé části systému lze řešit odděleně
- Pro určení T_s celého systému:

- Analyzují paralelní spojení

$$Q_{23} = Q_2 Q_3 = (1 - R_2)(1 - R_3) = 1 - R_2 - R_3 + R_2 R_3$$

$$R_{23} = 1 - Q_{23} = R_2 + R_3 - R_2 R_3$$

- Analyzují sériové spojení

$$R = R_1 R_{23} = R_1 R_2 + R_1 R_3 - R_1 R_2 R_3$$

- Pro exponenciální doby poruch $R_i(t) = e^{-\lambda_i t}$

$$R(t) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)t} + e^{-(\lambda_1 + \lambda_3)t} - e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)t}$$

$$T_s = \int_0^{\infty} R(t) dt = \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2} + \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_3} + \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3}$$



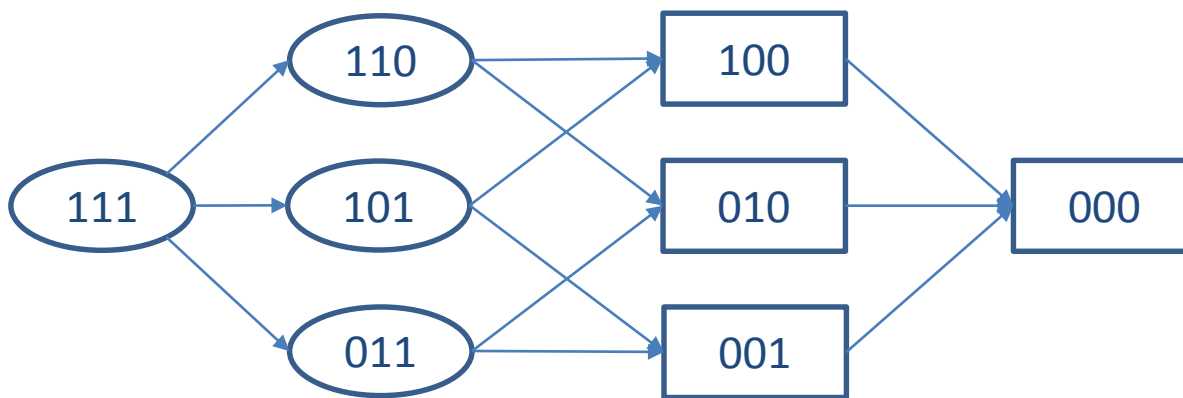
Stavový graf

- Složený model
 - může být v různých provozních a různých poruchových stavech
 - n prvků označených A_n , každý může být v provozu nebo porouchaný
 - přechod – 1 porucha nebo 1 oprava
- Potřebuji znát (obvykle empiricky zjistit) pravděpodobnosti jednotlivých stavů $p_i(t)$
 - Nezávislé, vzájemně se vylučující náhodné jevy
 - $R(t) = \sum_i p_i(t)$, i přes všechny provozuschopné stavy
- Pro model situací které nelze převést na sériové ani paralelní spojení



Stavový graf - příklad

- 3 prvky A_1, A_2, A_3 , potřebují aby fungovaly kterékoliv 2 z nich (je mi jedno které)

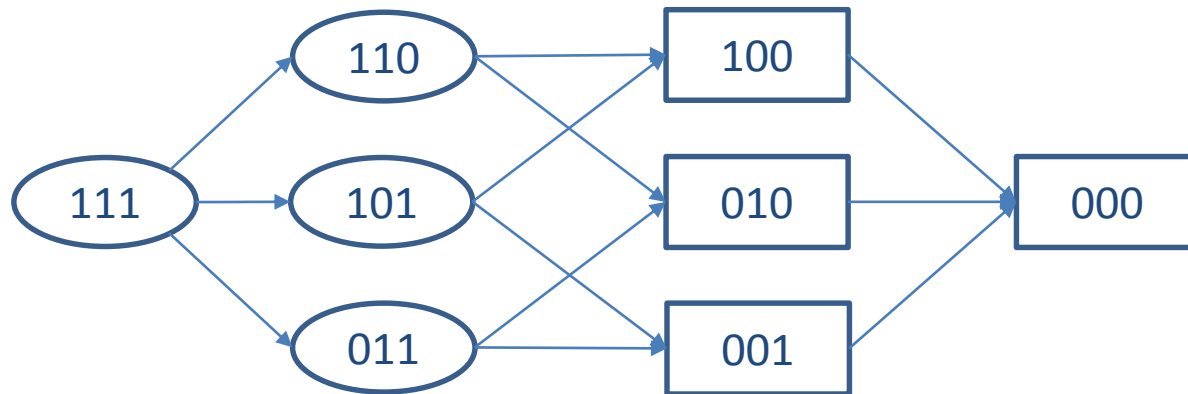


VSP - Spolehlivost

- Neobnovované \rightarrow všechny přechody jsou poruchy
- Stav kóduje dílčí poruchy
- Pokud známe $R_i(t)$ a $Q_i(t)$ jednotlivých prvků, lze určit celkové $R(t)$



Stavový graf - příklad



$$\begin{aligned}
 R &= R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 Q_3 + R_1 Q_2 R_3 + Q_1 R_2 R_3 \\
 &= R_1 R_2 R_3 + R_1 R_2 (1 - R_3) + R_1 (1 - R_2) R_3 + (1 - R_1) R_2 R_3 \\
 &= R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_2 R_3 - 2R_1 R_2 R_3
 \end{aligned}$$

- Za R lze opět dosadit odpovídající distribuční funkci (obvykle exponenciální rozdělení)



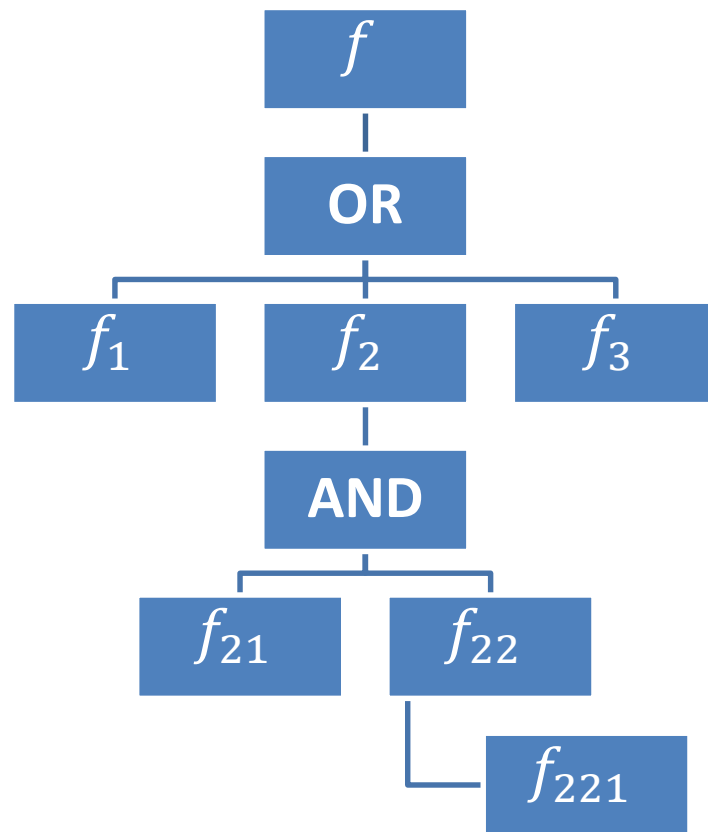
Strom poruch (Fault tree)

- Klasický model založený na množině událostí (obvykle poruch) které se se systémem mohou stát
 - Znám události a jejich pravděpodobnosti (funkce v čase / konstanty)
 - Zadány operátory („hradla“ – obvykle AND a OR)
 - Logická funkce (určují boolovskou hodnotu následující události)
 - Aritmetická funkce (určují pravděpodobnostní úroveň následující události)
- Model lze přehledně znázornit stromem událostí
- Lze snadno zjemňovat přidáváním dalších úrovní detailů
- Podstromy lze řešit odděleně
- Pro konstantní intenzity základních událostí lze převést na Markovský model → lze použít existující solvery



Strom poruch - příklad

- f – porucha systému
- f_1 - porucha CPU
- f_2 - ztráta napájení
- f_3 - porucha RAM
- f_{21} - porucha záložní baterie
- f_{22} - ztráta napájení hlavního zdroje
- f_{221} - omylem vytažený kabel ze zásuvky (prvd. 0,00002)

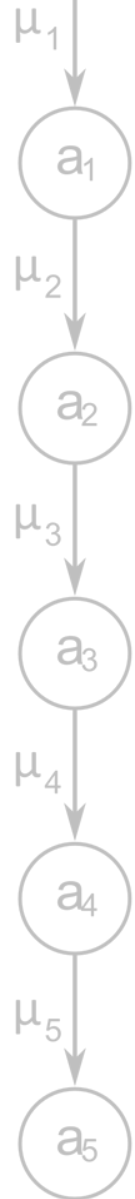


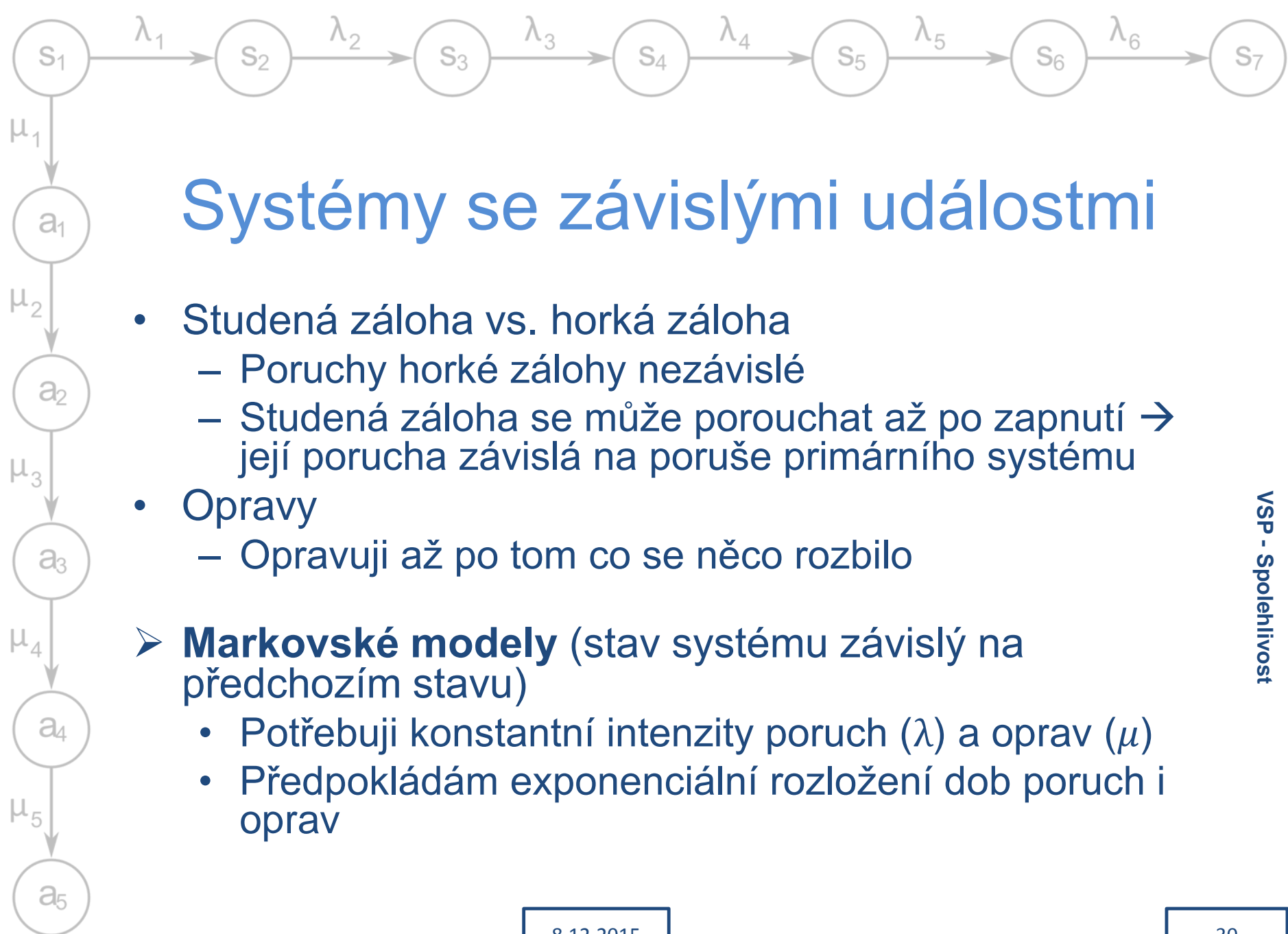
VSP - Spolehlivost



Strom poruch - hradla

- Pro nezávislé události:
 - AND: $P(A \text{ and } B) = P(A)P(B)$
 - OR: $P(A \text{ or } B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$
 - $P(A)P(B) \rightarrow 0$ pro velmi malé $P(A), P(B)$
 - XOR: $P(A \text{ xor } B) = P(A) + P(B) - 2P(A)P(B)$
- Strom sestaven pro každou nežádoucí událost zvlášť
 - Analýza shora dolů – vím jak vypadá porucha a hledám co k ní může vést





Systemy se závislými událostmi

- Studená záloha vs. horká záloha
 - Poruchy horké zálohy nezávislé
 - Studená záloha se může porouchat až po zapnutí → její porucha závislá na poruše primárního systému
- Opravy
 - Opravují až po tom co se něco rozbilo
- **Markovské modely** (stav systému závislý na předchozím stavu)
 - Potřebují konstantní intenzity poruch (λ) a oprav (μ)
 - Předpokládám exponenciální rozložení dob poruch i oprav

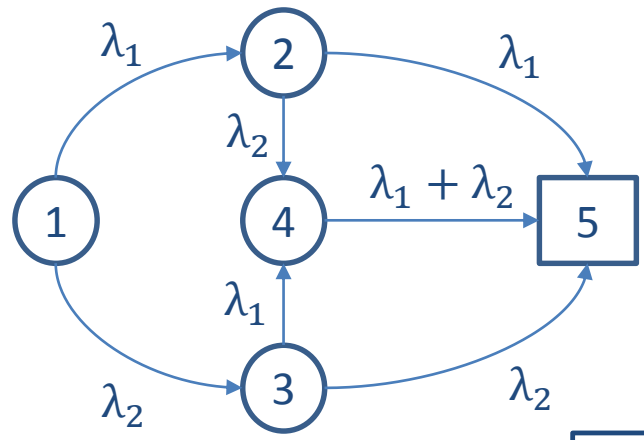
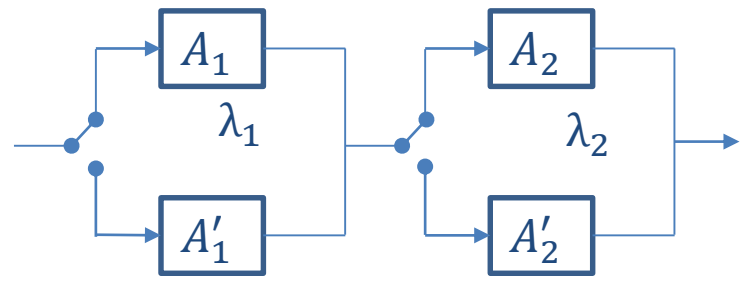


Markovské modely - neobnovované

- Model s absorpčními stavy
 - Po poruše se už systém nevrátí do provozuschopného stavu
 - acyklický graf markovského procesu
- Řešení soustavy lineárních diferenciálních rovnic – neexistují ustálené pravděpodobnosti (viz druhá přednáška)



Markovský model bez diferenciálních rovnic

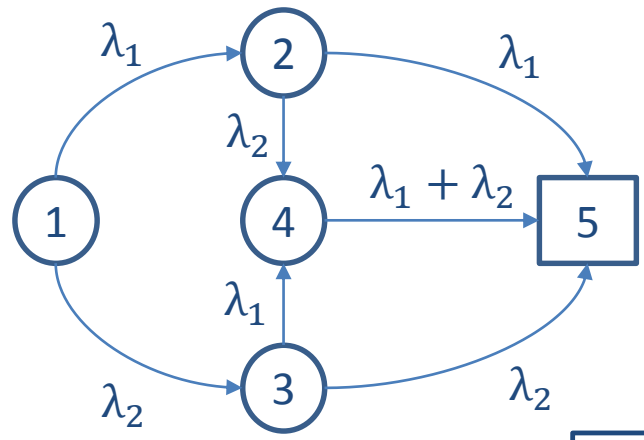
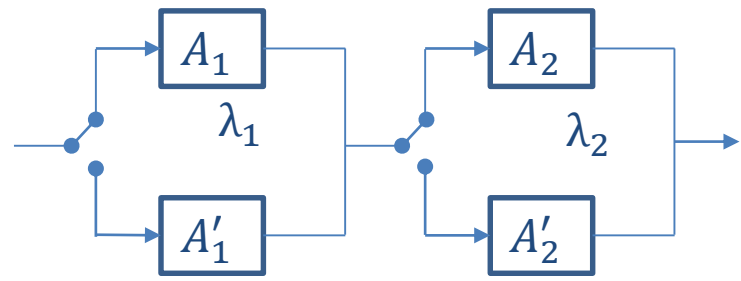


Stavy modelu:

1. Vše v pořádku
2. Modul A_1 nahrazen zálohou
3. Modul A_2 nahrazen zálohou
4. Oba moduly nahrazeny zálohou
5. Systém je nefunkční



Markovský model bez diferenciálních rovnic



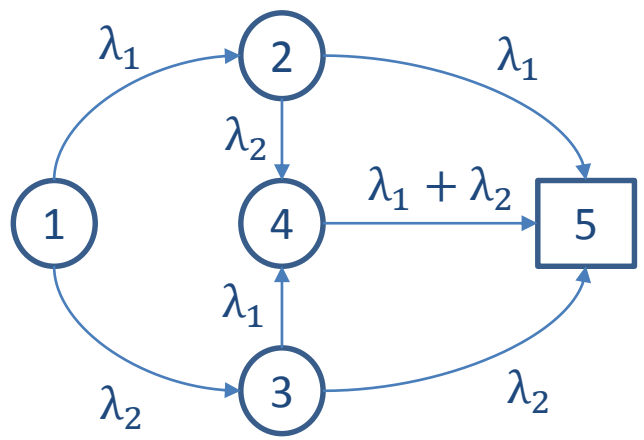
Určení T_S (střední doby provozu):

- Nalezení všech cest z 1 do 5 (4 možnosti)
- Určení dílčích T_{ci} (dob trvání cesty) a jejich pravděpodobností p_{ci}
- $T_S = \sum_{i=1}^4 T_{ci} p_{ci}$ - vážený průměr jejich délek

VSP - Spolehlivost



Markovský model bez diferenciálních rovnic



Určení T_{c1} pro cestu 1-2-4-5:

$$T_{c1} = \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2} + \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2} + \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

$$p_{c1} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \cdot \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \cdot \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}$$

Střední doba setrvání ve stavu:

$$T_i = \frac{1}{\sum_{odchozí} \lambda}$$

Pravděpodobnost přechodu

$$p_{ij} = T_i \lambda_i$$

VSP - Spolehlivost



Markovské modely – obnovované

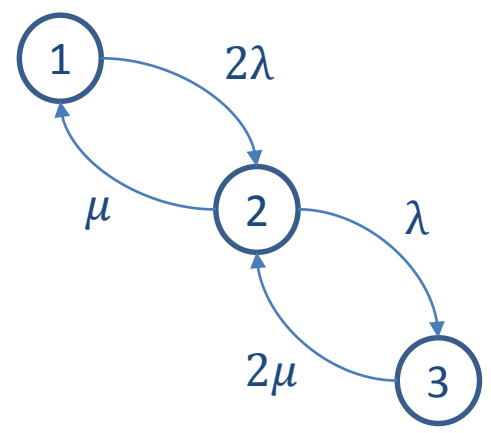


- Grafy obsahují cykly
 - Poruchy jedním směrem, opravy druhým
 - Stále mohou obsahovat absorbční stavy (něco opravit nejde)
 - Model pro nekonečně dlouhou dobu života → pokud jde vše opravit, lze pracovat s ustálenými pravděpodobnostmi
 - Místo diferenciálních rovnic dostanu lineární
- „*availability models*“ (místo „*reliability models*“)
- Koeficienty lze určit na základě analýzy pravděpodobnosti stavů modelu



Příklad bez absorbčních stavů

- 2 moduly, stačí mi jeden
 - Mohu opravovat jeden nebo oba zároveň (neomezená kapacita oprav)
 - Intenzita poruch λ , intenzita oprav μ



$$\begin{aligned}
 2\lambda p_1 &= \mu p_2 \\
 2\lambda p_1 + 2\mu p_2 &= (\lambda + \mu)p_1 \\
 \lambda p_2 &= 2\mu p_3 \\
 p_1 + p_2 + p_3 &= 1
 \end{aligned}$$

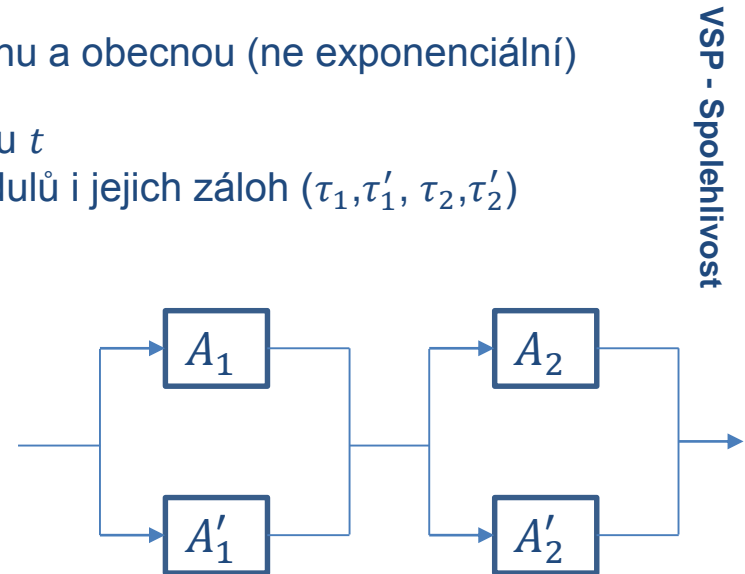
$$\begin{aligned}
 K_p &= p_1 + p_2 \\
 T_s &= \frac{p_1 + p_2}{\lambda p_2}
 \end{aligned}$$



Využití simulací

- Pro složité systémy (podobně jako u sítí front)
- Lze zachytit libovolnou logiku zapojení modulů, pravidla pro aktivace záloh i pro fungování oprav
- Výpočetní složitost úměrná počtu prvků
- Simulační pokus:
 - Systém se 2 prvky, každý má studenou zálohu a obecnou (ne exponenciální) hustotu poruch
 - Chci vědět jestli se systém porouchá do času t
 - Generuji 4 čísla – dobu do poruch obou modulů i jejich záloh ($\tau_1, \tau'_1, \tau_2, \tau'_2$)
 - Doba do poruchy: $\tau_{si} = \min\{\tau_1 + \tau'_1, \tau_2 + \tau'_2\}$
 - Pokud $\tau_{si} < t$ inkrementuji čítač K , vždy inkrementuji celkovou dobu $S = S + \tau_{si}$
 - Opakuji N krát – dostatečný počet pokusů!

$$T_s \cong \frac{S}{N}, P\{\tau_{si} < t\} \cong \frac{K}{N}$$





Děkuji za pozornost

- Příště předtermín
 - Nezapomeňte draft semestrální práce